

TEKNİK ŞARTNAMELER

1) SEM (Scanning Elektron Mikroskop) analizi

- Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile toz yatakta ergitilen tek çizgi üretimlerden hassas kesimle çıkarılan numune örneklerine taramalı elektron mikroskobu ile görüntüleme hizmeti yapılacaktır.
- Numunelerden 1 – 100.000 büyütme aralığında farklı büyütmelerde görüntüler alınacaktır.



Dr. Öğr. Üyesi Arif BALCI